

La storia in breve di alcuni dei nostri più importanti Prodotti industriali

Abbiamo iniziato a produrre microscopi per le biotecnologie nel 1919. Dopo 10 anni abbiamo iniziato a applicare la nostra tecnologia dei microscopi alle applicazioni industriali. Il resto è storia.



1929 Abbiamo fatto la prima apparizione nell'ambito delle ispezioni industriali attraverso il microscopio metallurgico MC

1955 Viene lanciato il nostro primo microscopio per la metrologia, il microinterferometro MI

1968 Impiego degli sviluppi tecnologici della nostra divisione in ambito medico per il lancio della serie IFS, i nostri primi prodotti RVI

1973 Lancio del modello 5221, il primo misuratore di spessori a ultrasuoni commerciale a livello globale con la misura multimodale e la taratura della velocità di propagazione

1984 Lancio del EPOCH® 2002, il primo rilevatore di difetti portatile completamente digitale a livello globale

1988 Lancio del primo misuratore di spessori del mondo con datalogger interno, il 22DL

1994 Introduzione delle funzionalità di datalogging e di gestione dei file negli strumenti portatili UT con il rilevatore di difetti dell'EPOCH III

└ Lancio del nostro primo microscopio al laser, l'OSL1000

2001 Lancio del nostro primo analizzatore XRF portatile, l'XT

└ Lancio dei nostri popolari videoscopi della Serie IPLEX™

2003 La tecnologia Phased Array diventa portatile attraverso il lancio del rilevatore di difetti OmniScan®

2008 Gli analizzatori XRD hanno finalmente un formato abbastanza ridotto per essere utilizzato su un banco o per essere portato sul campo: vengono lanciati gli analizzatori BTX® e TERRA®

2010 Lancio del rilevatore di difetti EPOCH 600, portatile, funzionale e resistente

2011 Lancio del nostro migliore apparecchio phased array, l'OmniScan MX2

2012 I microscopi passano al digitale attraverso il lancio della serie DSX

2014 Lancio del rilevatore di difetti eddy current NORTEC® 600

2016 Lancio del primo analizzatore XRF portatile progettato per soddisfare il grado di protezione IP64/65: l'analizzatore Vanta™

└ Introduzione dell'HD RVI™ a alta risoluzione attraverso il lancio del videoscopio IPLEX NX

2017 Lancio del nostro rilevatore di difetti a maggiore portatilità, l'EPOCH 6LT

└ Una nuova epoca di operatività connessa inizia con il lancio dell'Olympus Scientific Cloud™

